

K-Nr.: 25796
 K-no.:

Ansteuerübertrager / Drive Transformer

 Datum: 11.08.2010
 Date:

 Kunde:
 Customer

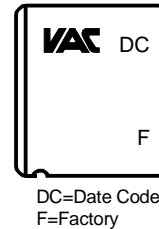
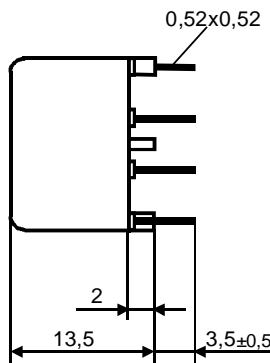
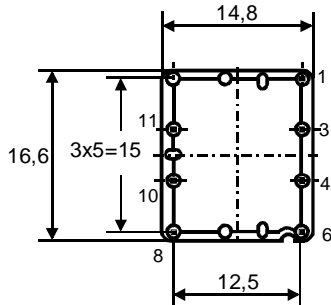
 Kd. Sach Nr.:
 Customers part no.:

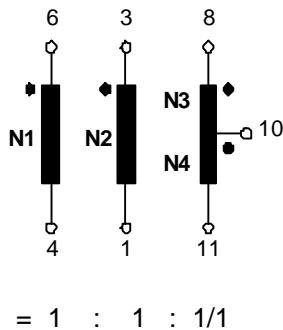
 Seite 1 von 1
 Page of

 Maßbild (mm):
 Mechanical outline

 Freimaßtoleranz DIN ISO 2768-c
 General Tolerances

 Anschlüsse:
 Connections:

 Toleranz der Stiftabstände ±0,2mm
 (Tolerances grid distance)

 Beschriftung:
 marking

 Anschlußschema:
 Schematic diagram

 Betriebsdaten/Charakteristische Daten (Nichtwerte):
 Operational data/characteristic data (nominal values):

 $R_{Cu1}; R_{Cu2}; R_{Cu3}; R_{Cu4} = 180 \text{ m}\Omega^* \pm 15\%$
 $L_1 = 2,5 \text{ mH}^* (f = 10 \text{ kHz}); U_E = 24 \text{ V}$
 $L_{s1-2}; L_{s1-3}; L_{s1-4} = 5 \text{ }\mu\text{H}^* (f = 100\text{kHz})$
 $C_{k1-2+3+4} \leq 15 \text{ pF}^* (f = 1 \text{ kHz})$
 $\int U_{dt} \geq 150 \text{ }\mu\text{Vs (unipolar)}$
 $U_{is,DC} = 900 \text{ V (N1-N3/N4; Betriebsisolation)}$
 $U_{is,DC} = 450 \text{ V (N1-N2, N2-N3/N4, Betriebsisolation)}$

 Umgebungstemperatur/ambient temperature: $-40^\circ\text{C} \dots +85^\circ\text{C}$

 Lagertemperatur/storage temperature: $-40^\circ\text{C} \dots +85^\circ\text{C}$

Prüfung: (V: 100%-Test; AQL...: DIN ISO 2859-Teil1)

Inspection

- | | | | | |
|---------------|----------|---|--|------------------------|
| 1) (V) | M3024: | $U_{p,eff} = 3 \text{ kV},$ | 2s, | N1 gegen/vs N2 + N3/N4 |
| | | $U_{TA, eff} \geq 0,7 \text{ kV}$ | | |
| 2) (V) | M3014: | $U_{p,eff} = 1,5 \text{ kV},$ | 2 s, | N2 gegen/vs N3/N4 |
| 3) (AQL 1/S4) | M3011/4: | Einstellwerte/Settings (N1) | $U_E = 7,5 \text{ V}, t_d = 20 \text{ }\mu\text{s}, f_p = 1 \text{ kHz}$ | |
| | | Prüfwert/Test value | $I_p \leq 130 \text{ mA}$ | |
| 4) (V) | M3011/6: | Polarität / Übersetzungsverhältnis: Toleranz $\pm 5\%$ | | |
| | | Polarity / Turns ratio: Tolerance | | |
| 5) (Fix05) | M3290: | Lötbarkeitstest nach Abschnitt 1 / solderability test acc. to chapter 1 | | |
| 6) (AQL 1/S4) | M3200: | Mechanische Prüfung / mechanical test | | |

 Messungen nach Temperaturangleich der Prüflinge an Raumtemperatur
 Measurements after temperature balance of the test samples at room temperature

* vorläufig/preliminary

Weitere Vorschriften:

Applicable documents:

Datum	Name	Index	Änderung
		81	

 Hrsg.: KB-E
 editor

 Bearb: Lo
 designer

 KB-PM: Yu
 check

 freig.: HS
 released

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9